

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
А В Т О М Е Т Р И Я

№ 6

1997

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «АВТОМЕТРИЯ» В 1997 ГОДУ

- Абаев М. И. Способ быстрого решения обратной задачи эллипсометрии для прозрачного однородного слоя, № 1.
- Абаев М. И., Пустотина С. Р. Исследование процесса окисления алюминиевых сплавов методом эллипсометрии, № 1.
- Алиев Т. А., Мусаева Н. Ф. Алгоритмы определения дисперсии и погрешностей, вызываемых помехами случайных сигналов, № 3.
- Анцыгин В. Д., Борзов С. М., Потатуркин О. И., Шушков Н. Н. Трансформация спектральных свойств углеводородного пламени при изменении режима горения, № 6.
- Арсенин И. М., Морозов Б. Б., Салов В. Г., Таранцев И. Г. Метод построения изображений в системах генерации титров, № 2.
- Асалханов Ю. И. Эллипсометрические параметры твердых тел в представлении набора линейных гармонических осцилляторов, № 2.
- Атучин В. В., Кострицкий С. М. Оптические характеристики волноводных слоев $\text{Cu} : \text{H} : \text{LiTaO}_3$, № 2.
- Аюпов Б. М. Установление анизотропии при калибровке лимбов азимутальных шкал эллипсометров, № 1.
- Аюпов Б. М., Иванова Е. Н., Ковалевская Ю. А. Эллипсометрическое и спектрофотометрическое исследование пленок ZnS и $\text{ZnS} : \text{Eu}$, полученных из летучих комплексных соединений, № 2.
- Бадалян А. М. См. Каичев В. В.
- Баев С. Г. См. Бессмельцев В. П.
- Бакакин Г. В., Белоусов П. Я., Дубнищев Ю. Н., Меледин В. Г., Похальчук Ю. А. Фотометрический способ измерения линейных размеров, № 4.
- Безуглов Д. А. Метод обеспечения априорно заданного закона сканирования в системе отклонения оптического луча, № 4.
- Белоусов П. Я. См. Бакакин Г. В.
- Бессмельцев В. П., Баев С. Г., Пальчикова И. Г. Растровые дифракционно-апертурные очки, № 6.
- Бобро В. В., Мардежов А. С., Семенов А. И. Обратная задача эллипсометрии для сверхтонких поверхностных пленок, № 1.
- Бобро В. В. См. Семенов А. И.
- Борзов С. М. См. Анцыгин В. Д.
- Борковская О. Ю. См. Дмитрук Н. Л.
- Бородовский П. А., Булдыгин А. Ф. СВЧ-методы измерения релаксации неравновесных носителей заряда и их применение для исследования эпитаксиальных пленок КРТ, № 6.

- Боронин В. А. См. Каичев В. В.
- Борщаговский Е. Г. Анализ ошибок для оптимизации эллипсометрических измерений, № 1.
- Борыняк Л. А., Захаров О. Н., **Логинов А. В.**, Меднис П. М. Определение формы поверхности деформируемых тел с помощью голографических интерферометров с адаптивной базой, № 3.
- Булгаков А. Ю., Вьюхин В. Н., Попов Ю. А., Тани Ю. Л., Шалагинов Ю. В. Измерительно-вычислительный комплекс для статистических исследований случайных сигналов, № 4.
- Булдыгин А. Ф. См. Бородавский П. А.
- Васьков С. Т. Сорок лет в Сибирском отделении Российской академии наук, № 3.
- Влох О. Г. См. Коструба А. М.
- Вовк Ю. В., Выдрин Л. В., Твердохлеб П. Е., Трубецкой А. В., Щепеткин Ю. А., Штейнберг И. Ш. Лазерная система для формирования трехмерных изображений в реальном времени, № 2.
- Волков Е. В., Плотников С. В. Исследование влияния ширины зондирующего пучка на погрешность измерения триангуляционных систем, № 2.
- Воробьев В. А., Лаходынова Н. В. Реконфигурация отказоустойчивой процессорной матрицы на основе сигналов согласия, № 6.
- Воскобойников Ю. Е., Касьянова С. Н., Кисленко Н. П., Трофимов О. Е. Использование алгоритмов нелинейной фильтрации для улучшения качества восстановленных томографических изображений, № 3.
- Воскобойников Ю. Е., Кисленко Н. П. Адаптивный рекуррентный регуляризирующий алгоритм восстановления сигналов и изображений, № 4.
- Воскобойников Ю. Е., Кисленко Н. П., Устюжанин К. В. Адаптивные алгебраические алгоритмы вычислительной томографии, № 6.
- Выдрин Л. В. См. Вовк Ю. В.
- Вьюхин В. П., Попов Ю. А., Тани Ю. Л. Исследование метода когерентной выборки для тестирования высокоразрядных АЦП, № 5.
- Вьюхин В. Н. См. Булгаков А. Ю.
- Грицкевич О. В., Мещеряков Н. А., Подъяпольский Ю. В. Отображение рисунков произвольной геометрической формы с криволинейной поверхности вращения на плоскость в расходящихся и сходящихся лучах, № 3.
- Грицкевич О. В., Мещеряков Н. А., Подъяпольский Ю. В. Формирование оптического изображения произвольной геометрической формы на криволинейных поверхностях вращения, № 2.
- Грозенок Д. А. См. Осипов А. Л.
- Грузман И. С. Двухэтапное восстановление дефокусированных изображений, № 2.
- Грузман И. С. Применение узкополосных случайных полсей в задаче выделения папиллярных линий на изображениях, № 4.
- Губарев В. В., Козлов А. И., Черепов Е. И. Вычислитель рангов на приборах с зарядовой связью, № 3.
- Гужов В. И., Нечаев В. Г., Мишина Е. М. Коррекция нелинейных ошибок задания начальной фазы при расшифровке интерферограмм методом пошагового фазового сдвига, № 4.

- Гурин Е. И., Коннов Н. Н. Построение скоростных высокоточных преобразователей временных параметров серий импульсных последовательностей, № 6.
- Гурьева Я. Л. Технологические аспекты численного решения смешанных краевых задач методом конечных объемов, № 5.
- Демехин В. В. Вертикальная запись информации для оптических ЗУ, № 6.
- Дмитрук Н. Л., Борковская О. Ю., Фурсенко О. В. Определение оптических параметров двухслойных поглощающих пленок методом многоугловой эллипсометрии с возбуждением поверхностных поляритонов, № 1.
- Дмитрук Н. Л., Забашта Л. А., Забашта О. И. Эллипсометрическое исследование влияния островковой металлической пленки на оптические свойства поверхности полупроводника, № 1.
- Досколович Л. Л. См. Соيفер В. А.
- Дубнищев Ю. Н. См. Бакакин Г. В.
- Ершова Е. Е. См. Соппа М. С.
- Ефимов А. С., Жмудь В. А., Падюков И. В. Прецизионный источник тока для полупроводникового лазера, № 3.
- Ефимов В. М., Касперович А. Н. Потенциальная точность обработки цифровых отсчетов сигнала при его восстановлении, № 5.
- Ефимов В. М., Колесников А. Н. Эффективность некоторых алгоритмов сжатия информации в двумерных массивах данных без потери точности при их восстановлении, № 6.
- Жмудь В. А., Падюков И. В. Прецизионная микропроцессорная система стабилизации температуры, № 5.
- Жмудь В. А. См. Ефимов А. С.
- Жуков Ю. А., Карлов Ю. К., Косых В. П., Поташников А. К., Обидин Ю. В., Чащин С. Б. Компьютерная томография в задачах контроля сварных соединений ТВЭЛ, № 4.
- Забашта Л. А. См. Дмитрук Н. Л.
- Забашта О. И. См. Дмитрук Н. Л.
- Зайченко С. Г. См. Поперенко Л. В.
- Захаров О. Н. См. Борыняк Л. А.
- Иванова Е. Н. См. Аюпов Б. М.
- Иманкулов З., Убайдуллаева Н. С., Якубов А. Н. Измерение разности фаз двух квантовых полей, № 3.
- Искаков И. А. См. Коронкевич В. П.
- Искаков И. А. См. Ленкова Г. А.
- Искольдский А. М. Разработка и исследование новых методов анализа результатов наблюдений в хаотической динамике. Ч. I, № 2.
- Кадыров А. А., Федотов Н. Г. Новые признаки изображений, инвариантные относительно группы движений и аффинных преобразований, № 4.
- Каичев В. В., Сорокин А. М., Боронин В. А., Бадалян А. М. Развитие спектральных методов исследования поверхности: аппаратно-программный комплекс сканирующей спектроскопии, № 5.
- Карлов Ю. К. См. Жуков Ю. А.
- Касперович А. Н. См. Ефимов В. М.
- Касьянова С. Н. См. Воскобойников Ю. Е.
- Катина И. В. См. Соифер В. А.

- Кириянов В. П. Метод прямого восстановления фазы квадратурных сигналов и его использование в системах позиционирования с нанометровым разрешением, № 3.
- Кисленко Н. П. См. Воскобойников Ю. Е.
- Ковалев А. М. О числе элементов изображения в поле зрения наблюдателя, № 3.
- Ковалевская Ю. А. См. Аюпов Б. М.
- Козлов А. И. См. Губарев В. В.
- Колесников А. Н. См. Ефимов В. М.
- Колосков В. А., Титов В. С. Управляющая система с самоорганизующим слоем, № 4.
- Колосова Ю. И.** Построение трасс причинно упорядоченных событий распределенного вычисления, № 5.
- Коннов Н. Н. См. Гурин Е. И.
- Корольков В. П. См. Полещук А. Г.
- Коронкевич В. П., Ленкова Г. А., Исаков И. А., Малышев А. И., Попков В. А., Юрлов Ю. И. Бифокальная дифракционно-рефракционная интраокулярная линза, № 6.
- Коронкевич В. П. См. Ленкова Г. А.
- Коронкевич В. П. См. Полещук А. Г.
- Кострицкий С. М. См. Атучин В. В.
- Коструба А. М., Влох О. Г. К анализу оптимальных условий эллипсометрического эксперимента, № 1.
- Косых В. П. См. Жуков Ю. А.
- Косых В. П. См. Ленкова Г. А.
- Котляр В. В., Сойфер В. А., Хонина С. Н. Алгоритм расчета дифракционных оптических элементов для генерации вращающихся модальных изображений, № 5.
- Котляр В. В. См. Скиданов Р. В.
- Кравец В. Г. См. Поперенко Л. В.
- Лабусов В. А. См. Ленкова Г. А.
- Лаходьнова Н. В. См. Воробьев В. А.
- Ленкова Г. А. Оптические характеристики интраокулярных линз в воздухе, воде и кювете, № 3.
- Ленкова Г. А., Коронкевич В. П., Исаков И. А., Косых В. П., Лабусов В. А. Исследование оптического качества интраокулярных линз, № 3.
- Ленкова Г. А. См. Коронкевич В. П.
- Ли И. И., Попов М. В. Многоходовый процессор с адаптивными устройствами предпроцессорной обработки сигналов для многоэлементных датчиков, № 6.
- Литвин А. И. Вычисление спектральных коэффициентов Уолша, Фурье и Хартли, № 2.
- Логинов А. В.** См. Борыняк Л. А.
- Макаров Л. И. Отделимость вершин взвешенного графа и алгоритмы их классификации, № 5.
- Малышев А. И. См. Коронкевич В. П.
- Мардежов А. С. См. Бобро В. В.
- Меднис П. М. См. Борыняк Л. А.
- Меледин В. Г. См. Бакакин Г. В.

- Мещеряков Н. А. См. Грицкевич О. В.
- Мишина Е. М. См. Гужов В. И.
- Моисеев С. Н. Различные гипотезы о функции распределения частоты экранирования спорадического слоя E ионосферы, № 3.
- Монахова Э. А., Монахов О. Г. Коллективные обмены в циркулянтных сетях параллельных вычислительных систем, № 6.
- Монахов О. Г. См. Монахова Э. А.
- Морозов Б. Б. См. Арсенин И. М.
- Мусаева Н. Ф. См. Алиев Т. А.
- Назаров Н. И. См. Спесивцев Е. В.
- Нечаев В. Г. См. Гужов В. И.
- Нечаев Е. П.** Влияние ошибок коррекции наклонов волнового фронта на статистические характеристики изображения в адаптивной оптической системе, № 4.
- Нечаев Е. П. Разрешающая способность адаптивной оптической системы с модовой компенсацией фазовых искажений сигнала, № 3.
- Нечаев Е. П. Точность компенсации фазовых искажений в адаптивной оптической системе, № 2.
- Обидин Ю. В. См. Жуков Ю. А.
- Осипов А. Л., Семенов Р. Д., Грозенок Д. А. Моделирование зависимости концентрации — эффект для системных фунгицидов-ингибиторов синтеза эргостерина, № 5.
- Падюков И. В. См. Ефимов А. С.
- Падюков И. В. См. Жмудь В. А.
- Пальчикова И. Г. См. Бессмельцев В. П.
- Паршин В. С. Оценка эффективности распознавания пространственно-временных сигналов в спектральной области, № 4.
- Пеньковский А. И. Фотоэлектрический цифровой поляриметр для анализа оптической активности, двойного лучепреломления и дихроизма, № 1.
- Плотников С. В. См. Волков Е. В.
- Подъяпольский Ю. В. См. Грицкевич О. В.
- Полещук А. Г. Дифракционные фильтры с переменным пропусканием, № 5.
- Полещук А. Г., Коронкевич В. П., Корольков В. П., Харисов А. А., Черкашин В. В. Синтез дифракционных оптических элементов в полярной системе координат: погрешности изготовления и их измерение, № 6.
- Поперенко Л. В., Зайченко С. Г., Юргелевич И. В. Обнаружение вязкохрупкого перехода в приповерхностных слоях сплавов оптическим методом, № 5.
- Поперенко Л. В., Кравец В. Г. Определение поляризационных параметров регистрирующих металлоаморфных сред, № 5.
- Попков В. А. См. Коронкевич В. П.
- Попов М. В. См. Ли И. И.
- Попов Ю. А. См. Булгаков А. Ю.
- Попов Ю. А. См. Вьюхин В. Н.
- Потатуркин О. И. См. Анцыгин В. Д.
- Поташников А. К., Финогенов Л. В. Измерение угловых перемещений с помощью многоэлементного фотоприемника, № 5.
- Поташников А. К. См. Жуков Ю. А.

Похальчук Ю. А. См. Бакакин Г. В.
 Пудов С. Г. Обучение клеточно-нейронной ассоциативной памяти, № 2.
 Пустотина С. Р. См. Абаев М. И.
 Рабинович Е. В. Компактное описание одномерного представления изображений, № 2.
 Рыхлицкий С. В. См. Спесивцев Е. В.
 Рыхлицкий С. В. См. Швец В. А.
 Савельев В. В., Твердохлеб П. Е., Трубецкой А. В., Щепеткин Ю. А. Формирование трехмерных изображений с помощью каскадного высокоскоростного акустооптического дефлектора, № 2.
 Савченко В. В. Тестирование спектральных оценок по выборке, № 4.
 Садов В. Г. См. Арсенин И. М.
 Салов Г. И. О мощностях непараметрических критериев для обнаружения протяженных объектов на случайном фоне, № 3.
 Свиташев К. К. Связанные эллипсы и связанные эллиптические колебания, № 1.
 Свиташев К. К., Чикичев С. И. Оптическая эллипсометрия на пороге 21-го века, № 1.
 Седухин А. Г. Двухкомпонентная аксиконная фокусировка светового излучения, № 5.
 Семенов А. И., Бобро В. В. О метрологическом обеспечении эллипсометрии (общий подход), № 1.
 Семенов А. И. См. Бобро В. В.
 Семенов Р. Д. См. Осипов А. Л.
 Скиданов Р. В., Сойфер В. А., Котляр В. В., Хонина С. Н. Оптико-цифровой эксперимент по идентификации дактилограмм, № 5.
 Сойфер В. А., Досколович Л. Л., Катина И. В., Харитонов С. И. Фокусировка в отрезок излучения протяженного некогерентного квазимонохроматического источника, № 6.
 Сойфер В. А. См. Котляр В. В.
 Сойфер В. А. См. Скиданов Р. В.
 Соколов С. В. О построении волноводно-оптического двоичного умножителя для оптических ЦВМ, № 3.
 Сопинский Н. В. Эллипсометрическое исследование эффекта фотолегирования в тонкопленочной структуре PbI_2-Cu , № 1.
 Соппа М. С., Ершова Е. Е. Численное решение обратной задачи рассеяния на импедансных телах при E - и H -поляризациях, № 2.
 Сорокин А. М. См. Каичев В. В.
 Спесивцев Е. В., Рыхлицкий С. В., Назаров Н. И. Автоматический сканирующий микроэллипсометр, № 1.
 Спесивцев Е. В., Рыхлицкий С. В. Эллипсометрия высокого пространственного разрешения, № 1.
 Тани Ю. Л. См. Булгаков А. Ю.
 Тани Ю. Л. См. Вьюхин В. Н.
 Таранцев И. Г. Оптимизированный алгоритм сжатия синтезированных изображений для систем реального времени, № 2.
 Таранцев И. Г. См. Арсенин И. М.
 Твердохлеб П. Е. См. Вовк Ю. В.
 Твердохлеб П. Е. См. Савельев В. В.

Титов В. С. См. Колосков В. А.
Троицкий Ю. В. Пределы справедливости модели проводящей поверхности при описании пограничных потерь в диэлектрических многослойниках, № 4.
Трофимов О. Е. См. Воскобойников Ю. Е.
Трубецкой А. В. См. Вовк Ю. В.
Трубецкой А. В. См. Савельев В. В.
Убайдуллаева Н. С. См. Иманкулов З.
Устюжанин К. В. См. Воскобойников Ю. Е.
Федотов Н. Г. См. Кадыров А. А.
Финогенов Л. В. См. Поташников А. К.
Фурсенко О. В. См. Дмитрук Н. Л.
Харисов А. А. См. Полещук А. Г.
Харитонов С. И. См. Соيفер В. А.
Хасанов Т. Аттестация и средства контроля эллипсометров, № 1.
Хасанов Т. Определение собственных поляризаций поляризующих оптических систем, № 1.
Хлудов С. Ю. Вейвлет-преобразования и компрессия изображений, № 2.
Хонина С. Н. См. Котляр В. В.
Хонина С. Н. См. Скиданов Р. В.
Чащин С. Б. См. Жуков Ю. А.
Черепов Е. И. См. Губарев В. В.
Черкашин В. В. См. Полещук А. Г.
Чикичев С. И. См. Свиташев К. К.
Чугуй Ю. В. Информационные, оптические и лазерные технологии, № 4.
Шалагинов Ю. В. См. Булгаков А. Ю.
Швец В. А., Рыхлицкий С. В. Метод эллипсометрии в науке и технике, № 1.
Штейнберг И. Ш. См. Вовк Ю. В.
Шушков Н. Н. См. Анцыгин В. Д.
Щеглов А. Ю. Методы децентрализованного кодового управления множественным доступом к общему ресурсу, № 4.
Щелеткин Ю. А. См. Вовк Ю. В.
Щелеткин Ю. А. См. Савельев В. В.
Юргелевич И. В. См. Поперенко Л. В.
Юрлов Ю. И. См. Коронквич В. П.
Якубов А. Н. См. Иманкулов З.